

各位

2014年4月1日
サイバネットシステム株式会社

FPD-AOI システムによる QCD 「品質・価格・納期」 実現をテーマにファインテックジャパンへ出展

タクトタイムの短縮や工程の改善・統合による生産性の向上、
業界初の測定器（サブピクセルレベルの一括測定）による技術革新、
サイバネットシステムの持つ光学技術の粋を集めた解決策を、
最先端の FPD の生産と開発に携わる皆様へ提案します。

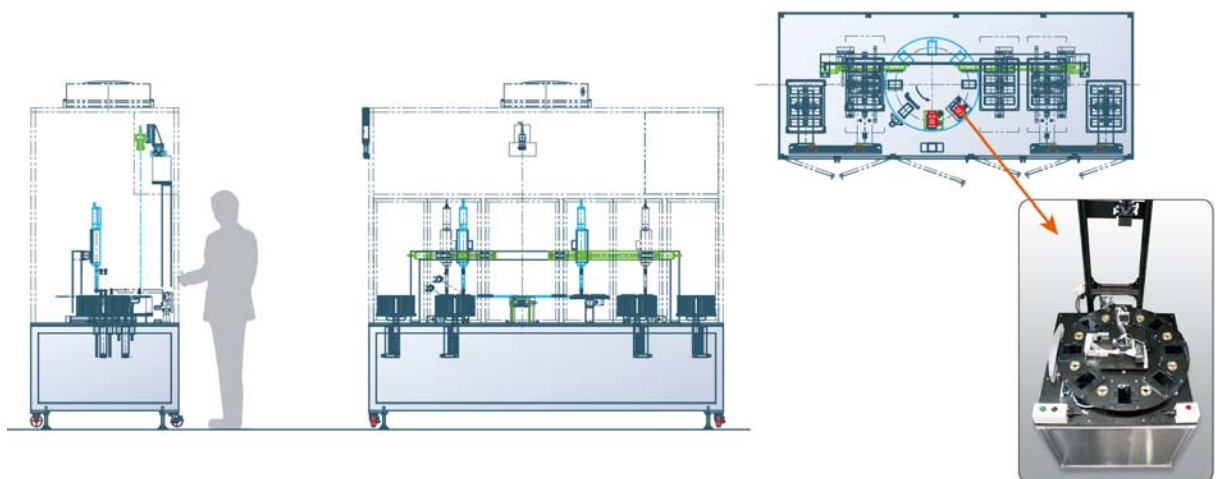
サイバネットシステム株式会社（本社：東京都、代表取締役：田中 邦明、以下「サイバネット」）は、2014年4月16日（水）から18日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「第24回 ファインテック ジャパン」に出展することをお知らせいたします。

近年、ディスプレイの高精細化が驚異的なスピードで進化しています。一方でディスプレイは世界規模の企業間競争が繰り広げられており、更なる高精細化・薄型化など市場からの性能要求の高度化に合わせた QCD の実現が大きな課題となっております。

サイバネットの FPD - AOI システムは、長年蓄積した光学技術に基づいたテクノロジーにより、高精細ディスプレイにおける複雑な現象を自動検証することができます。光学理論より導き出された結果を定量的に考察することにより品質が向上し、更には生産にかかるコストと時間を低減させ、所望の QCD を実現する環境を構築します。

今回の出展では、FPD - AOI システムによる QCD 実現をテーマに、タクトタイムの短縮や、工程の改善・統合による生産性の向上、業界初の測定器（サブピクセルレベルの一括測定）による技術革新など、サイバネットの持つ光学技術の粋を集めたソリューションを、最先端の FPD の生産と開発に携わる皆様へ提案します。

FPD-AOI システムイメージ



※サイバネットシステム（オプティカル事業部）の詳細については、下記 Web サイトをご覧ください。

<http://www.cybernet.co.jp/optical/>

お知らせ

出展概要

開催展名	第24回 ファインテック ジャパン
会期	2014年4月16日(水)～18日(金)
会場	東京ビッグサイト
主催	リード エグジビション ジャパン 株式会社
小間位置	12-38

「第24回 ファインテック ジャパン」の詳細につきましては、下記 Web サイトをご覧ください
<http://www.ftj.jp/>

サイバネットブースの見所

【生産】タクトタイムの短縮や工程の改善・統合による生産性の向上

自動検査による良否判定と定量評価、仕様ごとの製品供給や過剰品質抑制のためのソリューションをご紹介します。

こんな方にお勧めします

- 輝点・減点欠陥、微小輝線欠陥・輝点群、ガンマ調整、混色などを定量評価し製造品質を向上したい。
- 検査漏れの低減により品質・ブランドを更に向上させたい
- 人手による検査でのバラツキの改善、検査員の健康への影響・コストを改善したい。
- 高精度なフリッカ測定と自動調整による合否判定を短いタクトタイムで行いたい。

出展製品： FPD-AOI システム／FPiS-HS
 フリッカ高速自動調整ソリューション／flickn

製品特徴

- 最先端ディスプレイに対し高精度で高速な自動検査と調整が可能
- 液晶ディスプレイの検査に必要な検査をひとつのシステムにて提供
 (ムラ、輝点・減点欠陥、微小輝線欠陥・輝点群、ガンマ、混色、フリッカ)
- ピクセル単位の評価を行うことにより不具合箇所の正確なアドレスの特定が可能

※ お客様の検査内容と工程に合わせたカスタマイズが可能のため、現在の生産設備への置き換えも可能です。

【R&D】業界初の測定器（サブピクセルレベルの一括測定）による技術革新

当社独自の解析手法を用いることで、ディスプレイのサブピクセル単位のデータを正確に取得し、更なる高品質の製品開発へと繋げるための評価技術を用いた、ソリューションをご紹介します。

こんな方にお勧めします

- 部分的な測定やラフな測定ではなく、ディスプレイ全体を細かく測定したい。
- 高画素、高画素密度ディスプレイを正確に評価したい。
- さらなる高画質を目指し輝度補正を行いたい。

出展製品： FPD-AOI システム／FPiS-HP

製品特徴

- 1インチ以下の超小型からテレビや映像装置などの大型ディスプレイまで幅広く対応
- 4K2Kまで一括測定を可能とし、全ピクセルの相対輝度や欠陥ピクセル検出と正確なアドレス特定
- サブピクセル単位での補正係数フィードバック
- 輝度、ムラ、クロストークなどの定量評価

お知らせ

サイバネットについて

サイバネットシステム株式会社は、科学技術計算分野、特に CAE（※）関連の多岐にわたる先端的なソフトウェアソリューションサービスを展開しており、電気機器、輸送用機器、機械、精密機器、医療、教育・研究機関など様々な業種及び適用分野におけるソフトウェア、教育サービス、技術サポート、コンサルティング等を提供しております。具体的には、構造解析、射出成形解析、音響解析、機構解析、制御系解析、通信システム解析、信号処理、光学設計、照明解析、電子回路設計、汎用可視化処理、医用画像処理など多様かつ世界的レベルのソフトウェアを取扱い、様々な顧客ニーズに対応しております。

また、企業が所有する PC/スマートデバイス管理の効率化を実現する IT 資産管理ツールをはじめ、個人情報や機密情報などの漏洩・不正アクセスを防止し、企業のセキュリティレベルを向上させる IT ソリューションをパッケージやサイバネットクラウドで提供しております。

サイバネットシステム株式会社に関する詳しい情報については、下記 Web サイトをご覧ください。

<http://www.cybernet.co.jp/>

※CAE（Computer Aided Engineering）とは、「ものづくり」における研究・開発時に、従来行われていた試作品によるテストや実験をコンピュータ上の試作品でシミュレーションし分析する技術です。試作や実験の回数を劇的に減らすと共に、様々な問題をもれなく多方面に亘って予想・解決し、試作実験による廃材を激減させる環境に配慮した「ものづくり」の実現に貢献しております。

本件に関するお問い合わせ サイバネットシステム株式会社

- 内容について
オペティカル事業部/内海
TEL : 03-5297-3405 E-MAIL : optsales@cybernet.co.jp
- 報道の方は
広報室/目黒、関口
TEL : 03-5297-3066 E-MAIL : irquery@cybernet.co.jp